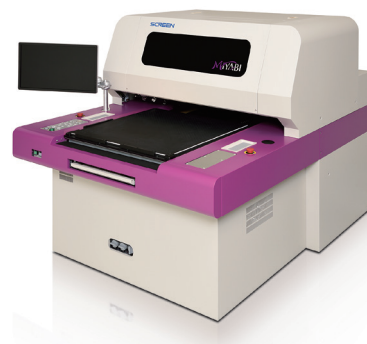


株式会社 SCREEN PE ソリューションズ

ハイエンドHDI基板向け光学式外観検査装置「MIYABI 7」を発売 ～欠陥検出精度の向上とイージーオペレーションを高いレベルで両立～

株式会社SCREEN PE ソリューションズ（以下、SCREEN PE）はこのほど、独自開発の光学系や新たな検査ロジックを搭載した光学式外観検査装置「MIYABI 7」を開発。この製品を、東京・有明の東京ビッグサイトで開催される「JPCA Show 2017（第47回国際電子回路産業展）」（6月7日～9日）に出展します。



MIYABI 7

☆この画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、
下記URLよりダウンロードできます。

(www.screen.co.jp/press/download/PE170607.zip)

近年、スマートフォンやタブレット端末など小型デバイスの進化に加え、車の衝突防止機能や自動運転など安全装置の普及とともに、HDI基板やフレキシブル基板には、高密度化・高精細化への要求が高まっています。このような動向を背景に当社は、30年以上にわたるプリント基板検査技術をさらに進化させ、欠陥検出精度とイージーオペレーションを高いレベルで両立したハイエンドHDI基板向け光学式外観検査装置「MIYABI 7」を開発しました。

「MIYABI 7」は、独自開発の多角ラインドーム型照明を搭載し、これまでパターン部と基材部のコントラストが確保しづらかった基板に対しても、良好な検査結果を提供。基板の種類に応じて波長の異なる3種類の照明が選択でき、さまざまな材質の基板に対して常に最適な検査環境を実現します。また、パッド幅・ライン幅ごとに個別のパラメーターで測長検査を行う「Pad & Line Feature検査機能」や、サブミクロン単位の測長を可能にする新しい穴検査ロジックなどの搭載により、欠陥検出精度を飛躍的に向上させました。さらに、専用のセットアップステーション「CU-9000」もシステムを刷新。複雑な設定が不要なため、セットアップから検査条件確定までのスキルレスな操作が可能となっています。

当社は、今回の「MIYABI 7」の開発を機に、直接描画装置「Ledia」との連携による品質向上や、ワークフローシステム「Sentflow」との連携による工程管理など、プリント基板製造工程の改善につながる新たな付加価値を提案し、プリント基板業界の発展に貢献していきます。

* 本製品は、2017年8月下旬の販売開始を予定しています。

● 本件についてのお問い合わせ先

株式会社SCREEN PE ソリューションズ 営業部 Tel: 075-417-2651 pe-info@screen.co.jp